

Elipsometru UVISEL

Domeniu de utilizare:

Studiul straturilor subtiri, materiale nanostructurate, oxizi micsti, structuri oxidice nanoporoase, interfete solid/lichid cu aplicatii in chimie si biologie.

Prin masuratori non-contact se determina constante optice, grosimea filmelor subtiri, compozitia materialelor.

Parametrii functionali:

- lumina polarizata in domeniul spectral 190-1000 nm, control computerizat al goniometrului, diametrul fasciculului de max. 5mm;
- extensie NIR in domeniul spectral 1000 - 2100 nm;
- unitate de mapare a probei;
- micropompa de sustinere a probei pe suport;
- celula de lichid simpla pentru studierea interfetelor solid/lichid si a cineticilor de adsorbtie;
- celula electrochimica;
- camera de control a temperaturii cu atmosfera controlata cu un domeniu de temperatura in intervalul -196°C pana la 600°C;
- rezolutia spectrala: 4 nm pe intreg domeniul spectral;
- masurarea matricii Mueller cu pana la 16 coeficienti;
- modul pentru masurarea probelor anizotropice;
- software pentru calibrare, achizitie date si analiza.

